

Messevorbericht SMT 2010, April 2010

## Schneider & Koch mit doppelseitigem AOI und kosteneffektivem ICT-Tischsystem auf der SMT

Zur Messe SMT 2010 stellt Prüftechnik Schneider & Koch erstmals sein neues, kompaktes ICT-System TI<sup>2</sup>GER I vor. Es handelt sich dabei um einen leistungsfähigen und gleichzeitig kostengünstigen In-Circuit-Tester. Mit seiner bedienerfreundlichen Testsoftware, den kompakten Ausmaßen, der hohen Testgeschwindigkeit von 800 Messungen/s sowie einem möglichen Pinausbau von bis zu 2.560 Pins eignet er sich nicht zuletzt auch aufgrund der geringen Anschaffungskosten optimal für die Überprüfung kleiner und mittlerer Losgrößen in der Elektronikfertigung. Das System verfügt standardmäßig über einen Programmgenerator, Selbsttestprogramme und Eigenkalibriertools. Mit einem Funktionstesteinschub lässt sich der TI<sup>2</sup>GER I leicht zum Kombi-Testsystem erweitern. Im Bereich optische Inspektion liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem Thema „doppelseitige AOI-Inspektion“. Mit dem automatischen optischen Inspektionssystem LaserVision Compact<sup>TWIN</sup>, das ebenfalls erstmals auf der SMT 2010 zu sehen sein wird, werden neue Dimensionen in der Qualitätssicherung doppelseitig bestückter Baugruppen erreicht. Durch die Integration eines zweiten Testkopfes in das bewährte LaserVision System, können nun doppelseitig bestückte Baugruppen gleichzeitig von oben und unten geprüft werden. Prüf- und Handlingzeiten können so signifikant gesenkt werden. Hoher Durchsatz und Produktivitätssteigerungen sind die Folge. Weiterer Schwerpunkt des diesjährigen Messeauftritts bilden leistungsfähige PXI-Komponenten und Chassis des US-amerikanischen PXI-Spezialisten GEOTEST, für den Schneider & Koch Alleindistributor in Deutschland ist. Um mehr über die neuen Produkte zu erfahren, besuchen Sie uns in der Halle 7 am Stand 7-125.



Abb. 1: Inspektionssystem LV Compact<sup>TWIN</sup>

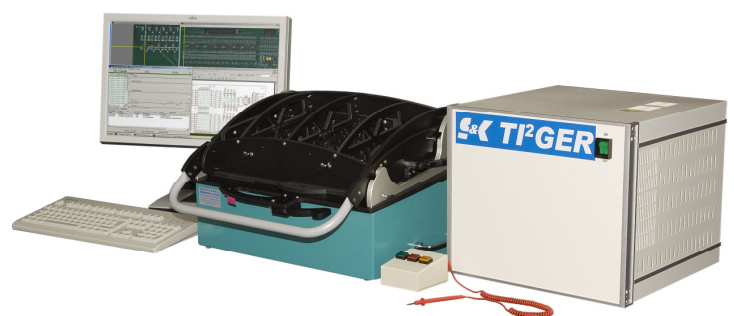


Abb. 2: ICT-Tischsystem TI<sup>2</sup>GER I